Notice of References Cited Application/Control No. 10/651,051 Examiner Binh X. Tran Applicant(s)/Patent Under Reexamination OKUDA ET AL. Art Unit Page 1 of 1

U.S. PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Name	Classification
	Α	US-2003/0020565	01-2003	Cornett et al.	333/197
	В	US-2003/0007262	01-2003	Tsuboi et al.	359/847
	ပ	US-2002/0131146	09-2002	Gee et al.	359/291
	D	US-6,271,955	08-2001	Atobe et al.	359/291
	E	US-6,555,201	04-2003	Dhuler et al.	428/137
	F	US-6,756,310	06-2004	Kretschmann et al.	438/694
	G	US-			
	H	US-			
	-	US-			
	J	US-			
	К	US-			
	L	US-			
	Μ·	US-			

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Country	Name	Classification
	N					
	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Р					
	Q					-
	R	- 1				
	s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Т	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

NON-PATENT DOCUMENTS

	MON-FAILIN DOCUMENTS						
*		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)					
	U						
	٧						
	W .						
	x						

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).)

Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.

a . . .